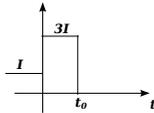


PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 12 Giugno 2017

ESERCIZIO 1

Una giunzione p^+n è caratterizzata da $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_p = 0.04 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\tau_p = 10^{-6} \text{ s}$, $S = 1 \text{ mm}^2$. Questa giunzione è polarizzata con $V = 0.4 \text{ V}$.



1) Determinare la corrente ed i parametri per piccolo segnale (resistenza e capacità differenziali) della giunzione (con $V = 0.4 \text{ V}$), verificando la condizione di bassa iniezione. [3]

2) A $t=0$ (vedi figura) la corrente viene bruscamente triplicata. Si determini il transitorio della carica e della tensione per $0 < t < t_0$, dove $t_0 = \tau_p$. Si determini inoltre la carica dovuta ai portatori minoritari iniettati per $t = t_0 = \tau_p$. [5]

3) Per $t = t_0 = \tau_p$ la corrente viene bruscamente portata a 0. Si calcoli il transitorio della carica e della tensione per $t > \tau_p$. [2]

ESERCIZIO 2

Un condensatore n -MOS, con gate in polisilicio ($N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$), viene illuminato uniformemente con luce rossa (lunghezza d'onda $\lambda = 630 \text{ nm}$). Per misurare l'intensità luminosa, viene applicato un gradino di tensione pari a 5 V a $t = 0$: $V_{GS} = 0 \text{ V}$ per $t < 0$ e $V_{GS} = 5 \text{ V}$ per $t > 0$.

1) Una volta determinata la tensione di soglia, calcolare la carica mobile, la carica fissa e la caduta di tensione nel silicio per $t = 0^+$. [3]

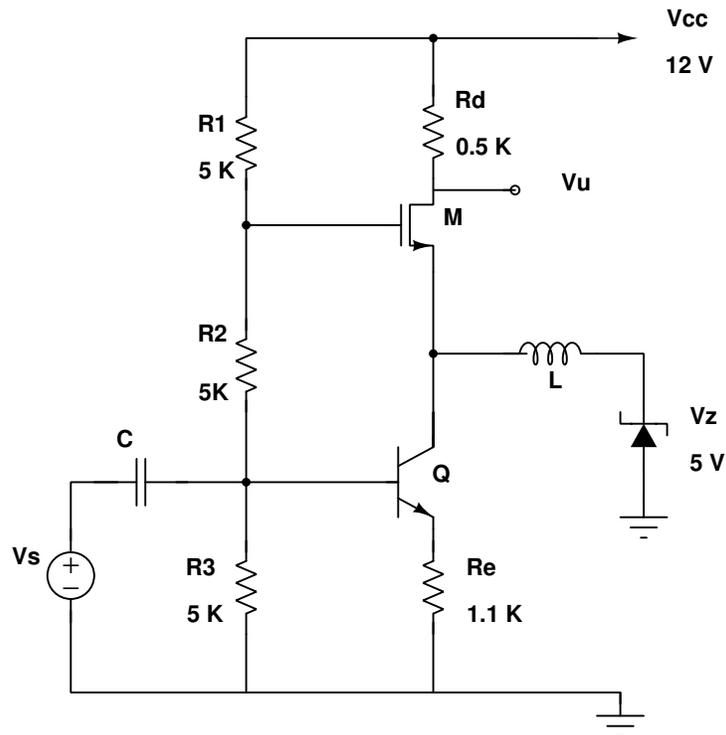
2) Dopo 5 ms viene misurata la carica mobile Q_n , che è risultata negativa e pari a 2 mC/m^2 . Determinare la caduta di tensione nel silicio e la carica fissa. [3]

3) Con riferimento al punto 2, parte della carica mobile è dovuta alla generazione ottica e parte alla generazione termica. La carica $Q_n \text{ termica}(t)$, dovuta alla generazione termica, si può calcolare con l'espressione $Q_n \text{ termica}(t) = Q_n \text{ regime} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}}\right)$, dove $\tau_n = 20 \text{ ms}$ e $Q_n \text{ regime}$ è la carica mobile del

condensatore MOS per tempi molto lunghi. Calcolare la carica dovuta all'illuminazione (dopo 5 ms) e determinare l'intensità della luce (potenza su unità di superficie, W/m^2). (NOTA: questo è un pixel per misurare l'intensità luminosa).[4]

ESERCIZIO 3

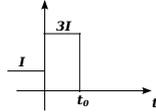
Nel circuito in figura, M è un transistore $n\text{MOS}$ con gate metallico ($\Phi_M = 3.8 \text{ V}$, $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$, $\mu_n = 0.08 \text{ cm}^2/\text{Vs}$). Il substrato è a massa (non indicato nel circuito) e non è cortocircuitato con il Source. Q è un transistore n^+pn con $\beta_{f \text{ min}} = 300$.



- 1) Determinare la tensione di soglia del transistore MOS.[4]
- 2) Determinare W/L del transistore MOS in maniera tale da avere $I_{DS} \simeq 4.6 \text{ mA}$. Determinare inoltre il punto di riposo dei transistori, verificando la polarizzazione del diodo Zener.[4]
- 3) Determinare il massimo valore della resistenza R_D che consenta la corretta polarizzazione del transistore $n\text{MOS}$. [2]

ESERCIZIO 1

Una giunzione p^+n è caratterizzata da $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_p = 0.04 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\tau_p = 10^{-6} \text{ s}$, $S = 1 \text{ mm}^2$. Questa giunzione è polarizzata con $V = 0.4 \text{ V}$.



1) Determinare la corrente ed i parametri per piccolo segnale (resistenza e capacità differenziali) della giunzione (con $V = 0.4 \text{ V}$), verificando la condizione di bassa iniezione. [3]

2) A $t=0$ (vedi figura) la corrente viene bruscamente triplicata. Si determini il transitorio della carica e della tensione per $0 < t < t_0$, dove $t_0 = \tau_p$. Si determini inoltre la carica dovuta ai portatori minoritari iniettati per $t = t_0 = \tau_p$. [5]

3) Per $t = t_0 = \tau_p$ la corrente viene bruscamente portata a 0. Si calcoli il transitorio della carica e della tensione per $t > \tau_p$. [2]

SOLUZIONE 1

1) Calcoliamo i parametri:

$$D_p = \frac{kT}{q} \mu_p = 1.036 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$
$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} = 32.19 \text{ } \mu\text{m}$$

Calcoliamo la corrente inversa di saturazione I_S :

$$I_S = qS \frac{n_i^2}{N_D} \frac{D_p}{L_p} = 2.32 \times 10^{-13} \text{ A} \quad (1)$$

Quindi per $V = 0.4 \text{ V}$ avremo:

$$I = I_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) = 1.18 \text{ } \mu\text{A}$$

$$r_D = \frac{V_T}{I} = 22 \text{ K}\Omega$$

Poiché $C_{diff}r_D = \tau_p$ avremo che la capacità di diffusione è pari a $C_{Diff} = \tau_p/r_D = 46 \text{ pF}$. Rimane da calcolare la capacità dovuta allo svuotamento (assumendo $N_A = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$):

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) = 0.855 \text{ V}$$

$$W(0.55 \text{ V}) = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_A} (V_0 - 0.6)} = 0.283 \text{ }\mu\text{m}$$

$$C_W = S \frac{\epsilon_s}{W} = 372 \text{ pF}$$

Verifichiamo la bassa iniezione, calcolando:

$$\delta p(0) = \frac{n_i^2}{N_D} e^{\frac{V}{V_T}} = 2.3 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

$$\delta p(0) \ll N_D$$

$$\delta p(0) \gg p_0$$

2) Per il transitorio, bisogna risolvere l'equazione di continuità dipendente dal tempo, in forma integrale (diodo a base nulla):

$$I(t) = \frac{Q(t)}{\tau_p} + \frac{dQ}{dt} \quad (2)$$

dove $I(t) = 3I$ per $0 < t < t_0$. A $t = 0$ la condizione a contorno è fissata dalla corrente I per $t < 0$:

$$Q(t = 0^+) = Q(t = 0^-) = I\tau_p \quad (3)$$

La soluzione si può scrivere come soluzione generale dell'omogenea associata, più una soluzione particolare, che può essere $Q(t) = \text{Costante} = 3I\tau_p$:

$$Q(t) = A e^{-\frac{t}{\tau_p}} + 3I\tau_p \quad (4)$$

Quindi, imponendo la condizione a contorno:

$$Q(t) = (I\tau_p - 3I\tau_p) e^{-\frac{t}{\tau_p}} + 3I\tau_p$$

$$Q(t) = I\tau_p \left(3 - 2e^{-\frac{t}{\tau_p}} \right)$$

L'andamento della tensione si calcola nella maniera usuale, supponendo la condizione di quasi- equilibrio:

$$Q(t) \simeq qSL_p \frac{n_i^2}{N_D} \left(e^{\frac{v(t)}{V_T}} - 1 \right) = I_S \tau_p \left(e^{\frac{v(t)}{V_T}} - 1 \right) \quad (5)$$

Otteniamo:

$$v(t) = V_T \ln \left(\frac{I}{I_S} \left(3 - 2e^{-\frac{t}{\tau_p}} \right) + 1 \right) \quad (6)$$

All'istante $t_0 = \tau_p$ la carica dovuta alle lacune iniettate risulta (basta sostituire τ_p nell'espressione della carica $Q(t)$):

$$Q(\tau_p) = I\tau_p \left(3 - 2e^{-1} \right) = 8.76 \times 10^{-10} \quad \text{C} \quad (7)$$

3) Per $t > t_0 = \tau_p$ avremo che la forma integrale dell'equazione di continuità dipendente dal tempo diventa:

$$0 = \frac{Q(t)}{\tau_p} + \frac{dQ}{dt} \quad (8)$$

con condizione a contorno:

$$Q(t = t_0^+) = Q(t = t_0^-) \quad (9)$$

Quindi avremo semplicemente:

$$Q(t) = Q(t_0) e^{-\frac{t-t_0}{\tau_p}} \quad (10)$$

ESERCIZIO 2

Un condensatore n -MOS, con gate in polisilicio ($N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$), viene illuminato uniformemente con luce rossa (lunghezza d'onda $\lambda = 630 \text{ nm}$). Per misurare l'intensità luminosa, viene applicato un gradino di tensione pari a 5 V a $t = 0$: $V_{GS} = 0 \text{ V}$ per $t < 0$ e $V_{GS} = 5 \text{ V}$ per $t > 0$.

1) Una volta determinata la tensione di soglia, calcolare la carica mobile, la carica fissa e la caduta di tensione nel silicio per $t = 0^+$. [3]

2) Dopo 5 ms viene misurata la carica mobile Q_n , che è risultata negativa e pari a 2 mC/m^2 . Determinare la caduta di tensione nel silicio e la carica fissa. [3]

3) Con riferimento al punto 2, parte della carica mobile è dovuta alla generazione ottica e parte alla generazione termica. La carica $Q_n \text{ termica}(t)$, dovuta alla generazione termica, si può calcolare con l'espressione $Q_n \text{ termica}(t) = Q_n \text{ regime} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}}\right)$, dove $\tau_n = 20 \text{ ms}$ e $Q_n \text{ regime}$ è la carica mobile del condensatore MOS per tempi molto lunghi. Calcolare la carica dovuta all'illuminazione (dopo 5 ms) e determinare l'intensità della luce (potenza su unità di superficie, W/m^2). (NOTA: questo è un pixel per misurare l'intensità luminosa). [4]

SOLUZIONE 2

1) Calcoliamo la tensione di soglia:

$$\begin{aligned}\psi_B &= V_T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 0.347 \text{ V} \\ |\Phi_{MS}| &= \frac{E_g}{2q} + \psi_B = 0.887 \text{ V} \\ C_{ox} &= \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.15 \times 10^{-3} \text{ F/m} \\ V_{TH} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B - |\Phi_{MS}| = 0.23 \text{ V}\end{aligned}$$

La carica mobile a $t = 0^+$ è nulla, poiché $Q(0^+) = Q(0^-) = 0$. Tutta la carica è dovuta allo svuotamento (svuotamento profondo), per cui avremo:

$$V_{GS} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{C_{ox}} + V_S - |\Phi_{MS}| \quad (11)$$

Risolvendo questa equazione abbiamo, come unica soluzione possibile, $V_S = 4.79 \text{ V}$. La carica fissa, dovuta alla regione di svuotamento, risulta allora (è negativa, in valore assoluto):

$$Q_W(0^+) = \sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S} = 1.27 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2 \quad (12)$$

2) Avremo (sia Q_W che Q_n sono negative):

$$V_{GS} = \frac{Q_n + \sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S}}{C_{ox}} + V_S - |\Phi_{MS}| \quad (13)$$

Risolvendo questa equazione otteniamo $V_S = 3.24$ V. Avremo dunque:

$$Q_W(5 \text{ ms}) = \sqrt{2\epsilon_s q N_A V_S} = 1.04 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2 \quad (14)$$

3) La carica mobile a regime si può determinare con l'espressione usuale:

$$Q_{n \text{ regime}} = C_{ox}(V_{GS} - V_{TH}) = 5.48 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2 \quad (15)$$

Quindi $Q_{n \text{ termica}}(5 \text{ ms}) = Q_{n \text{ regime}} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}}) = 1.2 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$. La carica Q_n dovuta alla generazione ottica risulta dunque: $Q_{n \text{ ottica}} = Q_n - Q_{n \text{ termica}} = 0.7 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$.

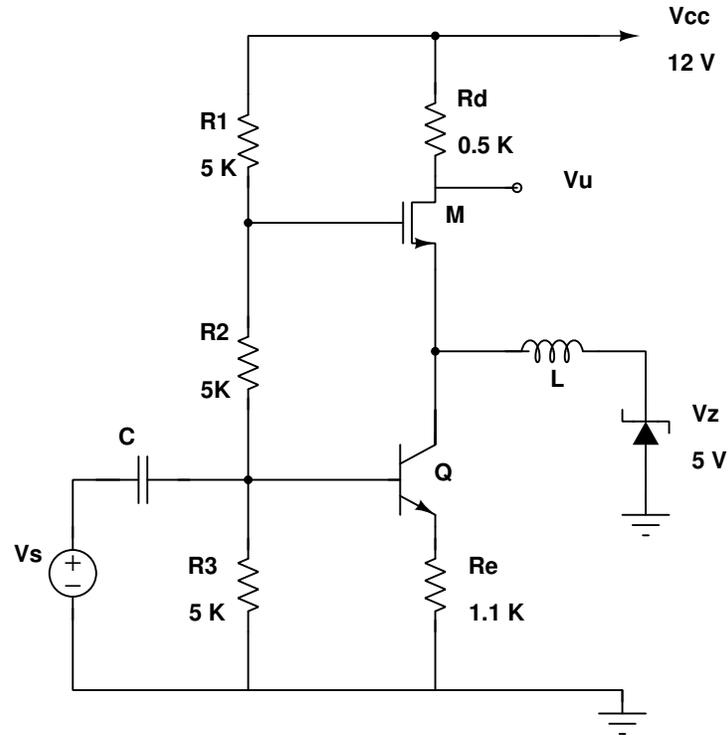
In 5 ms arrivano un totale di $\frac{0.7 \times 10^{-3}}{q} = 5 \times 10^{15}$ fotoni/m². Poichè ogni fotone ha una energia pari a $E_{fot} = q \frac{1.24}{0.63} = 3.15 \times 10^{-19}$ W, l'intensità luminosa risulta pari a $3.25 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{15} / 5 \text{ ms} = 0.31 \text{ Wm}^2$.

ESERCIZIO 3

Nel circuito in figura, M è un transistore n MOS con gate metallico ($\Phi_M = 3.8$ V, $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 30$ nm, $\mu_n = 0.08 \text{ cm}^2/\text{Vs}$). Il substrato è a massa (non indicato nel circuito) e non è cortocircuitato con il Source. Q è un transistore n^+pn con $\beta_f \text{ min} = 300$.

- 1) Determinare la tensione di soglia del transistore MOS.[4]
- 2) Determinare W/L del transistore MOS in maniera tale da avere $I_{DS} \simeq 4.6$ mA. Determinare inoltre il punto di riposo dei transistori, verificando la polarizzazione del diodo Zener.[4]
- 3) Determinare il massimo valore della resistenza R_D che consenta la corretta polarizzazione del transistore n MOS. [2]

SOLUZIONE 3



1) Per il transistor MOS, si svolgono i passaggi usuali. Bisogna tener conto, però, che il Source si trova ad un potenziale di 5 V ($V_S = 5$ V). Da ricordare che la tensione di soglia di un MOS è riferita al Source.

$$\psi_B = V_T \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 0.329 \text{ V}$$

$$\Phi_{MS} = \Phi_M - \left(q\chi + \frac{E_g}{2q} + \psi_B \right) = -1.169 \text{ V}$$

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = 1.15 \times 10^{-3} \text{ F/m}$$

$$V_{TH} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A (2\psi_B + V_S)}}{C_{ox}} + 2\psi_B + \Phi_{MS} = 0.314 \text{ V}$$

2) $V_G = 8$ V, e quindi $V_{GS} = V_G - V_S = 8 - 5 = 3$ V. Avremo dunque:

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2 L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$\frac{W}{L} = \frac{I_{DS}}{\frac{\mu_n C_{ox}}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2} = 14$$

Quindi per il MOS avremo:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S = V_G - V_Z = 3 \text{ V} \\ I_{DS} &= 4.6 \text{ mA} \\ V_{DS} &= V_D - V_S = V_{CC} - R_D I_{DS} - V_Z = 4.7 \text{ V} \end{aligned}$$

Il transistor è polarizzato in saturazione, essendo $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$. Per il transistor bipolare abbiamo che $V_B = 4 \text{ V}$, $V_E = V_B - V_\gamma = 3.3 \text{ V}$ e quindi $I_E = V_E / R_E = 3 \text{ mA}$. Quindi:

$$\begin{aligned} I_C &\simeq I_E = 3 \text{ mA} \\ V_{CE} &= V_C - V_E = V_Z - V_E = 5 - 3.3 = 1.7 \text{ V} \\ I_{B \max} &= \frac{I_C}{\beta_{f \min}} = 10 \mu\text{A} \ll \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2 + R_3} = 800 \mu\text{A} \end{aligned}$$

Nel diodo Zener scorrono $I_{DS} - I_C = 1.5 \text{ mA}$, quindi è correttamente polarizzato.

3) Il valore massimo di R_D è quello per cui il transistor MOS rimane in saturazione, cioè $V_{DS} \geq V_{DS \text{ sat}} = V_{GS} - V_{TH} = 2.69 \text{ V}$. Imponendo ($V_S = V_Z$):

$$V_{DS} = V_{CC} - R_D I_{DS} - V_S = V_{DS \text{ sat}} \quad (16)$$

Otteniamo $R_{D \max} = 940 \Omega$.